

# 半导体集成电路-内部水蒸气含量测试-百检网

产品名称	半导体集成电路-内部水蒸气含量测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务，简化检测流程，提升检测服务效率，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率，打破行业局限和行业瓶颈，打造出行业创新的检测平台。

1 半导体集成电路失效分析程序和方法 GJB3233-1998 5.2.4 X射线检查

2 半导体集成电路失效分析程序和方法 GJB3233-1998 5.1.6 内部检查

3 半导体集成电路失效分析程序和方法 GJB3233-1998 5.1.1 外部检查

4 半导体集成电路失效分析程序和方法 GJB3233-1998 5.2.8 密封性试验（检漏）

5 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法2001.1 恒定加速度

- 6 半导体集成电路失效分析程序和方法 GJB3233-1998 5.3.4 扫描电子显微镜分析
- 7 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法1010.1 温度循环
- 8 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法1008.1 稳定性烘焙
- 9 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法2020.1 粒子碰撞噪声检测试验
- 10 半导体集成电路失效分析程序和方法 GJB3233-1998 5.2.7 粒子碰撞噪声检测 ( PIND )
- 11 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 1014.2条件C1 粗检漏
- 12 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 1014.2条件A1 细检漏
- 13 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法1015.1 老炼试验
- 14 半导体集成电路失效分析程序和方法 GJB3233-1998 5.2.13 键合强度测试
- 15 半导体集成电路失效分析程序和方法 GJB 3233-98 5.2.4 X射线照相